

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu
Robotyzacja procesów wytwórczych
Studia pierwszego stopnia

Przedmiot:	Ochrona własności intelektualnej
Rodzaj przedmiotu:	Obowiązkowy
Kod przedmiotu:	RPW-1-S-0-1-MK03-0_0
Rok:	I
Semestr:	1
Forma studiów:	Studia stacjonarne
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze:	
Wykład:	15
Ćwiczenia:	-
Laboratorium:	-
Projekt:	-
Liczba punktów ECTS:	1
Sposób zaliczenia:	Test pisemny
Język wykładowy:	polski

Cel przedmiotu	
C1	Poznanie podstawowej wiedzy na temat własności intelektualnej i jej ochrony w Polsce i na świecie.
C2	Uświadomienie studentom wagi zabezpieczeń swoich praw wyłącznych i poszanowania cudzych praw wyłącznych.
C3	Ukształtowanie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji patentowej oraz pozostałych praw własności intelektualnej.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji	
1	Umiejętność korzystania z zasobów internetowych

Efekty kształcenia	
	W zakresie wiedzy:
EK1	Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
EK2	Ma podstawową wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w szczególności w zakresie powstawania i korzystania z własności intelektualnej.
EK3	Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania własnością intelektualną i wykorzystania jej w działalności gospodarczej.

	W zakresie umiejętności:
EK4	Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich uwzględniać aspekty prawne w zakresie systemu zarządzania własnością intelektualną, w tym ujawniania i ochrony informacji.
EK5	Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł informację patentową oraz dotyczącą pozostałych aspektów ochrony własności intelektualnej.
EK6	Potrafi interpretować uzyskane informacje dotyczące praw własności intelektualnej i dokonywać ich przetwarzania oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.
	W zakresie kompetencji społecznych:
EK7	Jest gotów do działania w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej

Treści programowe przedmiotu

Forma zajęć: wykłady

	Treści programowe:
W1	Podstawy prawne własności intelektualnej oraz przybliżenie pojęć własności intelektualnej wraz z charakterystyką dóbr takich jak.: utwór, wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografia układu scalonego, oznaczenia przedsiębiorstwa, know-how, nowe odmiany roślin.
W2	Przedmiot i podmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych. Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych, dozwolony użytek osobisty i publiczny. Przenoszenie praw (umowy licencyjne). Wolne licencje i zasoby Open Access oraz bazy literatury naukowej. Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Politechnice Lubelskiej – w części dotyczącej praw autorskich i praw pokrewnych.
W3	Przesłanki zdolności patentowej wynalazku, pojęcie czystości patentowej. Zakres prawa patentowego. Rozwiązania wyłączone spod ochrony patentowej. Wygaśnięcie i unieważnienie patentu, dodatkowe prawo ochronne (SPC).
W4	Ochrona wynalazków: krajowe, regionalne i międzynarodowe systemy ochrony patentowej (UPRP, EPO, PCT). Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Politechnice Lubelskiej – w części dotyczącej praw własności przemysłowej.
W5	Klasyfikacje stosowane dla własności przemysłowej: Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (klasyfikacja MKP), Wspólna Klasyfikacja Patentowa (CPC), Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska), Międzynarodowej Klasyfikacji Elementów Obrazowych Znaków Towarowych (klasyfikacja wiedeńska), Międzynarodowej Klasyfikacji Wzorów Przemysłowych (klasyfikacja lokarneńska), Międzynarodowej Klasyfikacji Wzorów Przemysłowych (klasyfikacja EuroLocarno).
W6	Przesłanki uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy. Systemy uzyskiwania ochrony wzoru użytkowego. Bazy danych wzorów użytkowych.
W7	Zdolność rejestrowa wzoru przemysłowego. Zakres i ograniczenia prawa z rejestracji na wzór przemysłowy. Ulga w nowości.
W8	Systemy ochrony wzorów przemysłowych: krajowe (UPRP), regionalne - wspólnotowy wzór przemysłowy (EUIPO), międzynarodowe (Porozumienie Haskie). Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Bazy danych wzorów przemysłowych.

W9	Rodzaje znaków towarowych. Zdolność odróżniająca znaku towarowego, bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego. Zakres i ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy.
W10	Systemy ochrony znaków towarowych: krajowe (UPRP), regionalne - unijny znak towarowy (EUIPO), międzynarodowe (Porozumienie Madryckie i Protokół do Porozumienia). Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy. Bazy danych znaków towarowych.
W11	Zdolność rejestracyjna oznaczenia geograficznego. Procedury ochrony oznaczenia geograficznego w trybie krajowym (UPRP), wspólnotowym: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Bazy danych chronionych oznaczeń geograficznych.
W12	Topografia układu scalonego - Przesłanki zdolności rejestrowej topografii układów scalonych. Systemy ochrony krajowej (UPRP). Ulga w oryginalności. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na topografię układów scalonych. Bazy danych topografii układów scalonych.
W13	Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (tajemnica przedsiębiorstwa, oznaczenia przedsiębiorstwa, oznaczenia informacyjne). Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Politechnice Lubelskiej – w części zasad komercjalizacji.
W14	Korzystanie z informacji patentowej. Metodologia poszukiwań prowadzonych w profesjonalnych bazach patentowych i wyszukiwarkach zawierających informację patentową.
W15	Pisemny test zaliczeniowy.

Metody dydaktyczne

1	Wykład z prezentacją multimedialną
2	Wykład konwersatoryjny
3	Wykład konwencjonalny - kursowy

Obciążenie pracą studenta

<i>Forma aktywności</i>	<i>Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności</i>
Godziny kontaktowe z wykładowcą:	15
W tym: Udział w wykładach:	15
Praca własna studenta:	
W tym: Samodzielne studiowanie tematyki wykładów, przygotowanie i udział w kolokwium zaliczającym wykład:	15
Łączny czas pracy studenta:	30
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:	1
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty):	

Literatura podstawowa	
1	<p>Zbiór aktualnych podstawowych przepisów prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 776) - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 910, z 2015 r., poz. 366 oraz z 2016 r. poz. 1840) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 41 poz. 241) - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji <p>Stan prawny aktualny na dzień: 28.11.2017 (Dz.U.2003.153.1503)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Stan prawny aktualny na dzień: 28.11.2017 (Dz.U.2017.0.229) - Zarządzenie Nr R-63/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego - Uchwała Nr 17/2017/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Politechnice Lubelskiej
2	Barta J. (red.), Prawo autorskie, Wyd. 4., C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2017
3	Skubisz R. (red.), Prawo własności przemysłowej, w System Prawa Prywatnego ; t. 14c, Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca	
1	Flisek A. (red.), Prawo własności przemysłowej, Wyd. 11, stan prawny: 1 kwietnia 2017 r., Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa cop. 2017
2	Kotarba W. Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, ORGMASZ 2001
3	Pyrża A. (red.), Poradnik wynalazcy, Wyd. 3, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2017

Macierz efektów kształcenia					
Efekt kształcenia	Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)	Cele przedmiotu	Treści programowe	Metody dydaktyczne	Metody oceny
EK1	RPW1A_w15+++	C1, C2, C3	W1, W2, W3 W4..W12	1,2,3	O1
EK3	RPW1A_w14+	C1, C2	W1, W13, W14	1,3	O1
EK4	RPU1A_u15+	C2,C3	W3, W4, W6, W8, W10, W11, W13	2,3	O1
EK5	RPU1A_u01+	C1, C3	W2..W14	1,2,3	O1
EK6	RPU1A_u01+	C1, C2, C3	W2, W6, W8, W10-W12,W14	1,3	O1
EK7	RPK1A_k03++	C2,C3	W2..W4, W6, W8, W10, W12	1,3	O1

Metody i kryteria oceny		
Symbol metody oceny	Opis metody oceny	Próg zaliczeniowy
O1	Pisemny test zaliczeniowy	51%

Autor programu:	mgr Małgorzata Jaworowska
Adres e-mail:	m.jaworowska@pollub.pl
Jednostka organizacyjna:	Biuro Rzecznika Patentowego